

横河Yokogawa AQ6317B光谱分析仪

产品名称	横河Yokogawa AQ6317B光谱分析仪
公司名称	深圳市捷威信电子仪器有限公司
价格	100000.00/台
规格参数	品牌:横河 型号:AQ6317B 产地:日本
公司地址	深圳市宝安区新桥街道万丰社区工人路A栋920
联系电话	0755-27538807 13145876435

产品详情

附加的功能：

50 GHz WDM 信号的宽动态范围：动态范围在峰值 ± 0.4 nm 时为 70 dB，在峰值 ± 0.2 nm 时为 60 dB。

高分辨率测量通过 50 GHz 间隔 WDM 系统实现宽动态范围。

高波长精度：在 1520 至 1580 nm 处提供 ± 0.02 nm 波长精度，在 1580 至 1620 nm 处提供 ± 0.04 nm 波长精度，具有 ± 0.01 nm 波长线性度，特别适用于 WDM 器件的高精度损耗波长特性和其他评估。

波长标度在空气和真空中都有指示。

高波长分辨率：实现 0.015 nm 的波长分辨率。

多种分析功能：WDM 和其他光学器件（LD、LED、FBG 等）的分析功能

同步扫描：与 AQ4321 可调谐激光源配合使用，可通过高速同步扫描实现更高的波长分辨率/宽动态范围

高灵敏度：高灵敏度允许测量低至 -90 dBm 的光，范围从 1200 到 1650 nm。

低偏振相关性：由于偏振相关性被抑制到 ± 0.05 dB，因此可以精确地进行光放大器增益等测量。

高精度：精度在 ± 0.3 dB 以内。

高功率测量：大。+20 分贝（100 毫瓦）

即使是光放大器的高功率输出也可以直接测量，无需光衰减器。

9.4英寸彩色液晶屏

可测量脉冲光

三个单独的痕迹记忆

规格

适用光纤：SMF、GI (50/125 m)

测量波长范围：600 至 1750 nm)

波长精度：±0.02 nm (1520 至 1580 nm ，使用内置参考光源校准后) ； ±0.04 nm (1580 至 1620 nm ，使用内置参考光源校准后) ； ±0.5 纳米 (600 至 1750 纳米)

波长线性度：±0.01 nm (1520 至 1580 nm) ； ±0.02 纳米 (1580 至 1620 纳米)

波长重复性：±0.005 nm (1 分钟)

波长分辨率：。分辨率：0.015 nm 或更好 (1520 至 1620 nm ，分辨率设置：0.01 nm)

分辨率设置：0.01、0.02、0.05、0.1、0.2、0.5、1.0、2.0 nm

分辨率精度：±5%：(1300 ~ 1650nm ，分辨率：0.05nm以上，分辨率修正：ON)

测量电平范围：-90 至 +20 dBm (1200 至 1650 nm ，灵敏度：HIGH3) ； -80 至 +20 dBm (1000 至 1200 nm ，灵敏度：HIGH3) ； -60 至 +20 dBm (600 至 1000 nm ，灵敏度：HIGH3)

电平精度 2、3) ±0.3 dB (1310/1550 nm ，输入：-30 dBm ，灵敏度：HIGH1-3)

电平线性度：±0.05 dB (输入：+10 至 -50 dBm ，灵敏度：HIGH1-3)

电平平坦度：±0.1 dB (1520 至 1580 nm) 、 ±0.2 dB (1580 至 1620 nm)

偏振相关性：±0.05 dB (1550/1600 nm) ， ±0.05 dB 典型值。(1310 纳米)

动态范围：60 dB (1523 nm ，峰值 ±0.2 nm ，分辨率：0.01 nm) ； 70 dB (1523 nm ，峰值 ±0.4 nm ，分辨率：0.01 nm) ； 45 dB (1523 nm ，峰值 ±0.2 nm ，分辨率：0.1 nm)

扫描时间：约。500 ms (跨度：100 nm 或更小，灵敏度：NORM ，HOLD ，平均：1 ，501 个样本，分辨率校正：OFF) ；大约。0.5 分钟 (跨度：100 nm 或更小，灵敏度：HIGH2 ，平均：1 ，501 个样本，无信号)

功能

自动测量：程序功能 (20 个程序 ，200 步) ，长期测量功能

测量条件设置：跨度设置：0 至 1200 nm

测量灵敏度设置：NORMAL HOLD/AUTO、MID、HIGH1/2/3

平均设定次数：1 ~ 1000次

样品编号设置：11 到 20001，AUTO

测量条件自动设定功能

标记间扫描功能

0 nm 扫描功能

脉冲光测量功能

空气/真空波长测量功能

TLS同步测量功能

轨迹显示

电平刻度设置：0.1 至 10 dB/div，线性

同时显示 3 条独立轨迹

保持显示

滚动平均显示

迹线间计算显示

标准化显示

曲线拟合显示

3D显示

分屏显示

功率密度显示、%显示、dB/km显示

横轴刻度频率显示

数据分析

WDM波形分析（Wavelength/Level/SNR列表显示）、光纤放大器分析（GAIN/NF、单/多通道）、PMD分析、滤光片分析、DFB-LD分析、FP-LD分析、LED分析、SMSR分析, 峰搜索, 谷底搜索, 谱宽搜索, 陷波宽度搜索

增量标记（多 200 个）、线标记（分析范围规范）

长期测量结果图表显示

其他

自波长校准功能（使用内置参考光源）

波长/电平补偿功能、标签功能、帮助功能

记忆

内置FDD：3.5英寸2HD

内部存储器：32 条轨迹，20 个程序

文件格式：轨迹文件、程序文件、测量条件文件、文本文件（轨迹、分析数据等）、图形文件（BMP、TIFF）

数据输出：打印机内置高速打印机

界面

遥控器：GP-IB（2个端口）；TLS 控制接口（TTL）

扫描触发输入（TTL）

采样使能输入（TTL）

采样触发输入（TTL）

模拟输出（0 至 5 V）

视频输出（VGA）

显示屏：9.4 英寸彩色 LCD（分辨率：640 x 480 点）

光连接器：FC（标准）

电源要求：AC 100 至 120/200 至 240 V，50/60 Hz

环境条件

工作温度：5 至 40 C

储存温度：-10 至 +50 C

湿度：80 %RH 或更低（无冷凝）

尺寸和质量：约。425 (W) x 222 (H) x 450 (D) 毫米

AQ6317B

是一款先进的光谱分析仪，适用于广泛的应用，包括光源评估、光学器件中损耗波长特性的测量以及 WDM（波分复用）系统的波形分析。

特别是在 C 波段和 L 波段，该单元实现了高波长精度和波长线性度，可以评估用于 WDM 的光学器件。分析功能使操作和扩展性变得简单。

AQ6317B 包含用于光谱分析仪的新 Ando 技术。下一代的参考设备。

与以前的型号相比，AQ6317B 的波长精度提高到 ± 20 pm，并且它也被指定为 L 波段。改进 WDM 分析功能和陷波宽度分析功能，新增多通道 NF 分析功能和滤光片分析功能。与其他改进一起使用变得更加容易，例如扫描加速。